Search Notes			

Application/Cont	rol No.	Applicant(s Reexaminat	/Patent under ion
10/031,197		WHITE ET	AL.
Examiner		Art Unit	
M. Lee		2614	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
-348	441	9/19/2005	ML
,	555		
	558		
	565		
	706		
	571		
,	572		
	557		
H04N	7/01		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	·		
	l		
L			

(INCLUDING SEAR	RCH STRATEGY)
	DATE	EXMR
EAST	9/19/2005	ML
	·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		